

SoC Test Systems

S210 LSI Test System

高スループット・ローコスト・省スペースで実現したマルチテストに対応したLSIテストシステムです。ファンクションテストは業界一の高スループットを実現。単なるロジックテストではなく、オプションのAD/DAモジュールを搭載する事により、1Bit-DAC等のAudioアナログ測定も可能にした幅広い用途に適用できるテストシステムです。

- 20/40MHz Test Rate
- 1024pins
- Per-Pin TG
- Multi-test Site 2DUT/ST

Target Device

DVD/CD-RW/CD-ROM/PHS/MCU/LCD-Dr/LTPS/SYSTEM LSI



Double Side Wafer Prober

WS50 Double Side Wafer Prober

WS50ダブルサイドプローバは、高電圧デバイス測定に最適な試験手法を提供する為に、新しく開発されたウエハ両面プロービング・コンタクト方式を採用した高精度測定高信頼性を実現したプローバです。

- 高精度な超低ON抵抗測定 (Id=100Aの実績)
- ウエハ上でのアパランシュ・スイッチング特性測定

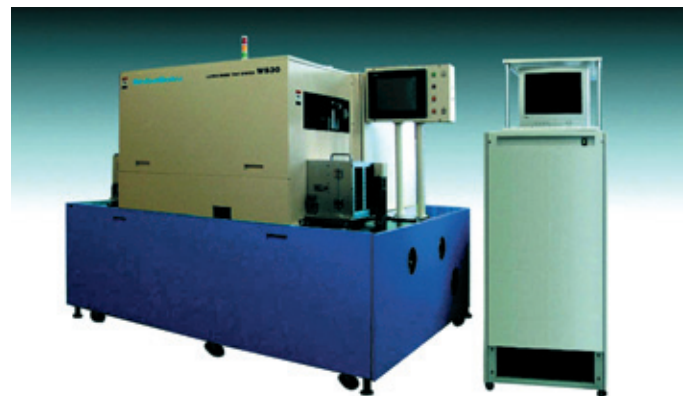


Optical Devices Test Systems

WS30 Laser Diode Test System

WS30は、インデックスパラレル手法により、複数個のデバイスをハイスループット測定を可能にしている他、各測定項目を分割して検査を必要とするデバイスに最適なテストシステムです。

- DVD/CDの2波長LD対応、又どちらかの1波長の測定も可能。
- Windows画面の採用により、各測定ステージの特性グラフ表示と容易な操作性を実現。
- 2デバイス同時測定、インデックパラレル方式の採用による、高速測定・高速処理を実現。



ATE4.1.02.YO